have a Pe whaleseett toch good!-! Ill

WEST

.,	Generate	Collection
3 :	(Tellerate	Conection

Print

JP 5-97965

L4: Entry 45 of 58

File: DWPI

Apr 20, 1993

DERWENT-ACC-NO: 1993-164534

DERWENT-WEEK: 199320

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Epoxy! resin compsn. useful for <u>sealing</u> semiconductor devices - comprises phenol! aralkyl resin and epoxy! resin obtd. by epoxidising phenol! aralkyl resin

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

MITSUI TOATSU CHEM INC

MITK

PRIORITY-DATA: 1991JP-0257378 (October 4, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 05097965 A

April 20, 1993

006

C08G059/20

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 05097965A

October 4, 1991

1991JP-0257378

water alls gold 0.38% p.163, Ex 1 M.lex XL-2L

INT-CL (IPC): C08G 59/20; C08G 59/32; C08G 59/62; H01L 23/29; H01L 23/31

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05097965A

BASIC-ABSTRACT:

An epoxy resin compsn. comprises a <u>phenol aralkyl resin or formula (I)</u> and an epoxy resin obtd. by epoxidating the phenol aralkyl resin at a mol. ratio of hydroxyl gp. in the phenol aralkyl resin:epoxy gp. in the epoxy resin of 0.5-1.5:1. In (I), n is at least 0.

USE/ADVANTAGE - The epoxy resin compsns. have a low modulus, a low linear expansion <u>coefft.</u>, a low water absorption and excellent heat, solder crack and solder water moisture resistance. They are useful for <u>sealing</u> semiconductor devices such as diodes, transistors, IC's and LSI's, and for paints, laminates and adhesives.

In an example, a mixt. of 100 pts. wt. of a resin with an epxoy equiv. of 240 g/equiv. and a softening temp. of 75 deg. C obtd. by reacting 'Milex XL-225' (RTM) and epichlorohydrin, 73 pts. wt. 'Milex XL-225' (RTM) with a softening temp. of 93 deg. C a phenol aralkyl resin), 1 pt. wt. triphenylphosphine as curing accelerator, 500 pts. wt. fused silica, 1.5 pts. wt., carnauba wax, 1 pt. wt. C black and 2 pts. wt. glycidoxypropyl trimethoxysilane was kneaded for 5 mins. at 100-110 deg. C, cooled and ground to give an epoxy resin compsn. A test specimen prepd. from the compsn. by compression moulding has a Tg of 145 deg. C, a modulus of 1440 kg/mm2, a water absorption of 0.38% and a linear expansion coefft. of 1.79 x 10 power (-5)/deg. C.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION USEFUL SEAL SEMICONDUCTOR DEVICE COMPRISE POLYPHENOL ARALKYL RESIN POLYEPOXIDE RESIN OBTAIN EPOXIDATION POLYPHENOL ARALKYL RESIN

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-97965

(43)公開日 平成5年(1993)4月20日

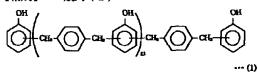
(51)Int.CL ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所	
C 0 8 G 59/20	NHN	8416—4 J			
59/32	NHQ	8416—4 J			
59/62	NJR	8416—4 J			
H01L 23/29		8617—4M	H 0 1 L * 23/ 30 R 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 6 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特願平3-257378		(71)出願人	000003126	
				三井東圧化学株式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)10	月4日		東京都千代田区霞が関三丁目 2番 5号	
			(72)発明者	安東 真司	
				愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地	
				三井東圧化学株式会社内	
			(72)発明者	飯室 茂	
				愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地	
				三井東圧化学株式会社内	
			1		

(54)【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

(修正有)

【構成】 一般式(1)



(式中、nはO以上の整数を示す)

で示されるフェノールアラルキル樹脂、および、該フェノールアラルキル樹脂をエポキシ化して得られるエポキシ樹脂を必須成分とする樹脂組成物であって、該エポキシ樹脂のエポキシ基1モルに対し、該フェノールアラルキル樹脂のヒドロキシル基が0.5~1.5モルであるエポキシ樹脂組成物。

【効果】 該樹脂組成物は、弾性率、線膨張率および吸水率が低く、かつ、優れた耐熱性を併せ有する。さらに、優れた耐半田クラック性と半田耐湿性を有するので半導体封止材として用いることができる。

【特許讃求の範囲】

*【化1】

••• (1)

(式中、nはO以上の整数を示す)で示されるフェノー 10%とにより、パッケージ内の水分が急激に膨張し、バッケ ルアラルキル樹脂、および、該フェノールアラルキル樹 脂をエポキシ化して得られるエポキシ樹脂を必須成分と する樹脂組成物であって、該エポキシ樹脂のエポキシ基 1モルに対し、該フェノールアラルキル樹脂のヒドロキ シル基が0.5~1.5モルであるエポキシ樹脂組成 物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エポキシ樹脂組成物に 関する。更に詳しくは、弾件率、線膨張率および吸水率 20 が低く、かつ、耐熱性および耐半田クラック性に優れた エボキシ樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ダイオード、トランジスタ、I C、LSIなどの半導体素子を封止する方法として、エ ポキシ樹脂等を用いた、いわゆる樹脂封止法が広く行わ れている。特に、エポキシ樹脂またはノボラック型フェ ノール樹脂を主成分とする樹脂組成物が原料の低廉さ、 耐熱性、成形性、電気特性に優れているため、樹脂封止 法の主流となっている。

【0003】ところで、最近の半導体素子関連技術の進 歩は殊の外早く、しかも多様化しており、従来のエポキ シ樹脂またはノボラック型フェノール樹脂を主成分とす る樹脂組成物を封止材として用いる従来の方法では解決 し得ない種々の問題が生じている。

【0004】例えば、ICの高集積化に伴いチップサイ ズが大型化し、逆にバッケージの形状は、表面実装化の 更なる伸長もあり、小型化、薄型化の傾向にある。すな わち、大型のチップを小型で薄型のパッケージに封入す る必要が生じ、この際、熱応力によりクラックが発生し 40 大きな問題となっている。

【0005】また、半田づけ工程においては、パッケー ジそのものが200℃以上の高温に急激にさらされるこ※

ージ内にクラックを発生させ、半導体の信頼性を低下さ せる原因となっている。

2

【0006】これらの問題を解決するために、種々のエ ボキシ組成物が提案されているが、未だ充分な効果が得 られていない。

【0007】例えば、特開昭59-105018号公報 には硬化剤として、フェノールとアラルキルエーテルと の重縮合物を用いた封止用樹脂組成物が提案されてい る。しかし、この樹脂組成物は、低吸水率、低弾性率の 点では優れているものの、ガラス転移温度が低いため耐 熱性が劣り、耐半田クラック性の点では満足のいくもの ではない。

【0008】また、特開昭61-168620号公報に は、耐熱性に優れたエポキシ樹脂組成物が提案されてい る。該組成物は、多官能性エポキシ樹脂を使用している ため架橋密度が上がり、耐熱性が優れている。しかし、 吸水性が高くなり、特に半田づけ工程でクラックが発生 する頻度が高く満足のいくものではない。

[0009]

30 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 の問題を解決することを課題とし、弾性率、線膨張率お よび吸水率が低く、かつ、耐熱性および耐半田クラック 性に優れたエポキシ樹脂組成物を提供することにある。 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、フェノー ルアラルキル樹脂、および、該フェノールアラルキル樹 脂をエポキシ化して得られるエポキシ樹脂を必須成分と するエポキシ樹脂組成物が上記の課題を解決するもので あることを見出し、本発明に到ったものである。

【0011】すなわち、本発明は、一般式(1)〔化 2)

[0012]

【化2】

$$CH_2$$
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2

40

(式中、nは0以上の整数を示す)で示されるフェノールアラルキル樹脂、および、該フェノールアラルキル樹脂をエポキシ化して得られるエポキシ樹脂を必須成分とする樹脂組成物であって、該エポキシ樹脂のエポキシ基1モルに対し、該フェノールアラルキル樹脂のヒドロキシル基が0.5~1.5モルであるエポキシ樹脂組成物である。

【0014】本発明のエボキシ樹脂組成物は、上記一般 はたもの、分子内オレフ式(1)で表されるフェノールアラルキル樹脂、およ ボキシ樹脂等(以下、併び、該フェノールアラルキル樹脂をエボキシ化して得ら 20 することも可能である。れるエボキシ樹脂を必須成分とするが、その他のフェノ 「0020】この併用エボキ 境剤等を本発明の目的を損なわない範囲であれば添加し 最%未満であることが好てもよい。 と本発明のエボキシ樹脂

【0015】本発明に用いるフェノールアラルキル樹脂は、一般的には、フェノールとα, α'ージメトキシパラキシレン、α, α'ージクロロパラキシレン等をフリーデルクラフツ反応により縮合させることによって得ることができる。代表的なものがミレックスXL(三井東圧化学(株)製)という商品名で市販されている。該フ30ェノールアラルキル樹脂は、上記一般式(1)における nが0以上の整数であるが、0~20であることが本発明の目的から好ましい。

【0016】本発明に用いるエボキシ樹脂は、上記のフェノールアラルキル樹脂をエボキシ化することにより得られる。エボキシ化する方法は公知の方法が適用できる。すなわち、ハロゲン化水素アクセプターの存在下、40~120℃の温度範囲において、フェノールアラルキル樹脂をエピハロヒドリン、好ましくはエピクロルヒドリンを用いてエボキシ化する。

【0017】ハロゲン化水素アクセプターの例としては、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属水酸化物を挙げることができる。ハロゲン化水素アクセプターはフェノールアラルキル樹脂とエピハロヒドリンとの加熱された混合物に徐々に添加され、反応混合物のpHを約6.5~10に維持するようにするのが好適である。

【0018】エポキシ化反応に使用されるエピハロヒド め好ましくない リンの割合はフェノールアラルキル樹脂のOH基含有量 で併用してもよ によるが、通常、該OH基1当量に対し、2.0~30 50 もかまわない。 4

当量、好ましくは2.0~10当量の過剰量のエピハロ ヒドリンが使用される。反応生成物から過剰のアクセプ ター物質および副生する塩を除去する方法は、通常、水 洗等の手段によって行われる。

【0019】上述のように、本発明において用いるエボキシ樹脂は、ハロゲン化水素アクセプターの存在下で、前記一般式(1)で示されるフェノールアラルキル樹脂をエピハロヒドリンを用いてエボキシ化することにより得られるエボキシ樹脂(以下、必須エボキシ樹脂という)であるが、この他、ノボラック樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂、レゾール系フェノール樹脂等のグリシジルエーテル、ブタンジオール、ボリエチレングリコール、ボリプロピレングリコール等のアルコール類のグリシジルエーテル、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル酸等のカルボン酸のグリシジルエステル、アニリン、イソシアヌール酸等の愛素原子に結合した活性水素をグリシジル基で置換したもの、分子内オレフィンをエボキシ化した脂環式エボキシ樹脂等(以下、併用エボキシ樹脂という)を併用することも可能である。

【0020】この併用エポキシ樹脂の使用量は、必須エポキシ樹脂と併用エポキシ樹脂の合計量に対し、50重量%未満であることが好ましい。50重量%以上であると本発明のエポキシ樹脂組成物の最大の特徴である上記の特性、すなわち、弾性率、線膨張率および吸水率が低く、かつ、耐熱性に優れると言う特性が保てなくなるので好ましくない。

【0021】また、本発明においては、上記一般式 (1)で表されるフェノールアラルキル樹脂を硬化剤と して用いるが、その他、ノボラック樹脂、ジシクロペン タジエン変性フェノール樹脂またはレゾール系フェノー ル樹脂等(以下、併用フェノール樹脂という)を併用す ることも可能である。

【0022】これらの併用フェノール樹脂の使用してもよい量は、本発明の構成成分であるフェノールアラルキル樹脂と併用フェノール樹脂の合計量に対し、50重量%未満であることが好ましい。50重量%以上であると本発明のエボキシ樹脂組成物の最大の特徴である上記の特性、すなわち、弾性率、線膨張率および吸水率が低く、かつ、耐熱性に優れると言う特性が保てなくなるので好ましくない。

【0023】これらの併用フェノール樹脂の軟化点が60~120℃、OH基当量が90~500の範囲が好ましく、さらに好ましくは軟化点が65~100℃、OH基当量が95~400の範囲である。軟化点またはOH基当量が、上記の範囲を外れる場合は、本発明のエボキシ樹脂組成物の特徴である上記の特性が保てなくなるため好ましくない。これらの併用フェノール樹脂は、単独で併用してもよいが、2種以上の混合物として併用してもかませない。

【0024】必須エポキシ樹脂と硬化剤であるフェノー ルアラルキル樹脂の混合比は、該エボキシ樹脂のエボキ シ基1モルに対し、フェノールアラルキル樹脂のヒドロ キシル基が0.5~1.5モルの範囲が好ましい。この 範囲を外れると、本発明のエポキシ樹脂組成物の特徴で ある上記の特性が保てなくなるため好ましくない。

【0025】併用エポキシ樹脂および/または併用フェ ノール樹脂を用いる場合は、それぞれ合計のエポキシ基 1モルに対し、合計のヒドロキシル基が0.5~1.5 モルの範囲とすることがが好ましい。

【0026】本発明のエポキシ樹脂組成物には、硬化促 進剤としてエポキシ樹脂のエポキシ基と硬化剤樹脂であ るフェノールアラルキル樹脂等のヒドロキシル基の反応 を促進する化合物を用いることができる。

【0027】該硬化促進剤として、例えば、トリエチル アミン、ベンジルジメチルアミン、トリエタノールアミ ン、トリス (ジメチルアミノメチル) フェノール、トリ エチルアミン、トリエチレンテトラミン、メタキシレン ジアミン、ジメチルベンジルアミン等のアミン類、2-メチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、1,2 20 できる。 ーメチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダ ゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2フェニルイミ ダゾール等のイミダゾール類、トリフェニルホスフィ ン、トリブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフ ィン、メチルジフェニルホスフィン、ブチルフェニルホ スフィン、ジフェニルホスフィン、フェニルホスフィ ン、オクチルホスフィン、1、2-ビス (ジフェニルホ スフィノ) メタン等の有機ホスフィン類、テトラフェニ ルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニル ホスフィンテトラフェニルボレート、2-エチル-4- 30 メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、N-メチ ルモルホリンテトラフェニルボレート等のテトラフェニ ルボロン塩等が挙げられる。

【0028】その添加量はエポキシ樹脂に対し0.00 1重量%から5重量%が好ましい。添加量が0.001 重量%未満の場合はエポキシ樹脂のエポキシ基と硬化剤 樹脂のヒドロキシル基の反応に時間がかかりすぎるので 好ましくない。また、5重量%を越える場合は、本発明 のエポキシ樹脂組成物の特徴である上記の特性が保てな くなるため好ましくない。

【0029】また、本発明には無機充填剤として、結晶 性シリカ、溶融シリカ、アルミナ、クレー、チタンホワ イト、ジルコン、ホウ素、ベリリア、マグネシア、ジル コニア、フォーステライト、ステアタイト、スピネル、 ムライト、チタニア、硫酸バリウム、石英ガラス、水酸 化アルミニウム、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化珪 素、アルミナ、ガラス繊維等を1種以上配合することが できる。

【0030】さらに、本発明には必要に応じて、高級脂 肪酸、高級脂肪酸金属塩、エステル類、天然ワックス

類、合成ワックス類、酸アミド類、パラフィン等の離型 剤、ブロム化合物、アンチモン、リン等の難燃化剤、カ ーボンブラック等の着色剤、エポキシシラン、アミノシ ラン、ピニルシラン、アルキルシラン、有機チタネート 等のシランカップリング剤、その他、可撓性付与剤等の 添加剤を適宜配合してもよい。

【0031】上記の原材料を用いて本発明のエポキシ樹 脂組成物を製造する一般的な方法としては、所定の配合 量の原材料混合物をミキサー等によって充分混合したの 10 ち、熱ロール、押出機等によって混練し、冷却し、粉砕 する方法を挙げることができる。

【0032】また、本発明のエボキシ樹脂組成物を用い て半導体を封止する方法としては、低圧トランスファー 成形法が一般的であるが、インジェクション成形、圧縮 成形、注型等の方法を採用する事もできる。

【0033】以上のようにして得られる本発明のエポキ シ樹脂組成物は、弾性率、線膨張率および吸水率が低 く、かつ、優れた耐熱性を有するので、半導体の封止材 の他、塗料、積層材または接着剤等として用いることが

[0034]

【実施例】以下、製造例、実施例、比較例、試験例を示 して本発明をさらに詳細に説明する。

【0035】製造例1

三井東圧化学 (株) 社製、ミレックスXL-225 (軟 化点93℃) を50gとエピクロルヒドリン150gを 混合し、撹拌機、温度計、ディーンスターク共沸蒸留ト ラップ、滴下ロートを備えた反応容器に装入した。この 混合物を撹拌しながら115~119℃に昇温した後、 同温度で47%水酸化ナトリウム水溶液64gを2時間 で滴下し、留出した水は連続的に分離回収し、エピクロ ルヒドリンの相は反応器に戻した。滴下終了後留出水の 除去により反応は終了する。この後過剰のエピクロルヒ ドリンを減圧蒸留し、反応生成物をメチルイソブチルケ トン200gに溶解し、塩化ナトリウム及び水酸化ナト リウムをろ過した後、溶剤を減圧蒸留により留去し、必 須エポキシ樹脂を得た。 エポキシ当量は240g/e q、軟化点は75℃であった。この樹脂を樹脂Aとす る。

40 【0036】実施例1

製造例1で製造した樹脂A、硬化剤樹脂として軟化点8 0℃の三井東圧化学(株)社製、ミレックスXL-22 5 (この樹脂を樹脂Bとする)、硬化促進剤としてトリ フェニルホスフィン(以下、TPPと言う)、充填剤と して溶融シリカ、離型剤としてカルナウバワックス、着 色剤としてカーボンブラック、カップリング剤としてグ リシドキシプロピルトリメトキシシランを〔表1〕に示 す重量比で配合し、混練温度100℃~110℃、混練 時間5分の条件でロール混練を行った。シート状の混練 50 物を冷却したのち、粉砕しエボキシ樹脂組成物を得た。

【0037】次に、該組成物を200kg/cm²、1 70℃において5分間圧縮成形することにより所定の形 状の成形品を作製し、さらに、175℃で5時間ポスト キュアーした。得られた成形品のガラス転移温度、線膨 張係数、曲げ弾性率、吸水率を評価した。

【0038】ガラス転移温度(単位:℃);理学電機製 TMA装置を用い成形品の温度ー線膨張曲線から、その 屈曲点の温度をガラス転移温度とした。温度測定は常温 から250℃まで、昇温速度は2℃/分とした。

【0039】線膨張係数 (単位:×10⁻⁵/℃);常温 10 た結果を〔表1〕に示す。 からガラス転移温度までの値を求めた。

【0040】曲げ弾性率 (単位: kg/mm²); 島津 *

*製作所製オートグラフを用い、4mm×127mm×1 0mmの成形品で、試験速度2mm/分、支点間距離6 4mmで行った。

【0041】吸水率(单位:%);50mm×50mm ×2mmの成形品を100℃で24時間煮沸した後の重 量変化から求めた、得られた結果を〔表1〕に示す。

【0042】実施例2、比較例1~2

それぞれ〔表1〕に示す原料を用い、実施例1と同様に して成形品を得、同様にして各特性を評価した。得られ

[0043]

【表1】

四77年代平(平位:K 8 / mm·);局律 * 【教11					
		実施例		比較例	
		1	2	1	2
エポキシ樹脂	種類	樹脂A	樹脂A	EOCN *	EOCN *
エッイン倒帽	重量部	100	100	100	100
硬化剤	種類	樹脂B	樹脂B	PN **	XL ***
OSC 1 CJEN	重量部	73	73	49	81
展ルル水	種類	TPP	24Z****	TPP	TPP
硬化促進剤	重量部	1	1	1	1
溶融シリカ(重量部)	500	500	464	560
カルナウバワックス(重量部)	1.5	1.5	1.5	1.5
カーボンブラック(重量部)	1	1 .	1	1
グリシドキシブロビル キシシラン (2	2	2	2
ガラス転移温度 (°C)		145	150	143	130
弹性率 (kg/mm²)		1440	1442	1530	1450
吸水率 (%)		0. 38	0. 39	0. 49	0.42
線膨張係数(×10°/°C)	1. 79	1.78	1.85	1.84	
注> +FOCN・ナルソクレバールノゼニック刑ェギキン場形					

注> *EOCN:オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、

エポキシ当量 214、軟化点 75℃、日本化薬 (株) 製; EOCN 102S

**PN:フェノールノボラック樹脂、軟化点96℃

*** XL:ザイロック樹脂、三井東圧化学(株) 製; XL-225LL

**** 24Z:2-エチル-4-メチルイミダゾール

【0044】試験例

実施例1~2、比較例1~2で製造したエボキシ樹脂組 成物をタブレット化し、低圧トランスファー成形にて、 175℃、70kg/cm²、120秒の条件で、半田

※ケージに封止し、また半田耐湿試験用として3mm×6 mmのチップを16pSOPパッケージに封止した。 【0045】封止したテスト用素子について下記の半田

クラック試験及び半田耐湿試験を行った。

クラック試験用として6×6mmのチップを52pパッ※50 半田クラック試験 ; 封止したテスト用素子を85℃、8

5%RHの環境下で72時間放置し、その後260℃の 半田浴に10秒間浸した後、顕微鏡で外部クラックを観 察し、クラックが発生した素子の数を計数した。

【0046】半田耐湿試験; 封止したテスト用素子を8 5℃、85%RHの環境下で72時間放置し、その後2 *カー試験 (125℃、100%RH) を行い回路のオー プン不良率が50%となる時間を測定した。試験結果を 〔表2〕に示す。

10

[0047] 【表2】

60℃の半田浴に10秒間浸した後、プレッシャークッ*

		半田クラック性	半田耐湿性		
}		(クラック数/総数)	(50%不良発生時間)		
試験例	1	0/16	300時間以上		
試験例	2	0/16	300時間以上		
比較試験例 1		16/16	180時間		
比較試験	例2	3/16	290時間		

[0048]

【発明の効果】本発明のエポキシ樹脂組成物は、弾性 率、線膨張率および吸水率が低く、かつ、優れた耐熱性

※耐湿性を有するので半導体封止材として用いることがで きる。また、上記の特性を生かして塗料用、積層用およ び接着剤用等として広い分野において利用できるので、 を併せ有する。さらに、優れた耐半田クラック性と半田※20 産業上極めて有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

HO1L 23/31